特

鋼球落下による基板の衝撃強度信頼性評価

Method of Shock Analysis for PCBs Subjected to Ball Impacts

あらまし

携帯電話などモバイル機器に搭載されているLSIパッケージおよびメモリなどは,微細な はんだボールによって実装するBGA (Ball Grid Array)タイプが主流である。これらの実 装部品は落下衝撃に対する実装強度が重要であり,その接合信頼性は自由落下試験で確認し ている。しかし,この試験では落下姿勢を一定にすることは難しく,衝撃の再現性がないた め評価が安定しないなどの問題があった。これらの解決方法として,プリント基板 (PT 板)の自由落下と同程度の衝撃歪みを与える鋼球落下による評価法を検討してきた。そこで 鋼球落下による衝撃寿命測定のための装置を開発し,BGAの寿命試験に関して,PT板の固 定方法と衝撃歪み,鋼球の落下高さと衝撃歪み,およびBGA破断判定などを評価した。同 時に,自由落下と鋼球落下衝撃による歪みを衝撃解析ソルバ"LS-DYNA"によって計算し, LSIパッケージ近傍のPT板表面に発生する衝撃歪みをそれぞれの実測結果と比較した。

Abstract

The LSI packages of mobile devices are mainly BGA (Ball Grid Array) packages, which are soldered onto PCBs using minute solder balls. Obviously, the solder joints of these packages must be strong so the device can withstand being dropped, and this is usually checked by conducting drop tests. However, because it is difficult to reproduce the same device orientation and kinetics at the time of impact in each test, the results are not very consistent. To improve the results, we examined a testing method in which the device under test is subjected to the same forces as in a free fall by striking it with a falling steel ball. Then, we developed a device that tests resistance to repeated impacts by a falling steel ball and evaluated its performance. Also, we analyzed the strains and distortions that occur on PCB surfaces during free-fall impacts and impacts by falling steel ball and then compared the analysis results with measurements made in experiments with actual devices. This paper describes the method of shock analysis we used in this investigation.



 ・証明 正(たての ただし)

 PLM/開発革新センター物理シミュ
 レーション技術部 所属
 現在,エレクトロニクス実装技術,
 および製品開発における数値解析に
 ば重。



井門 修(いど おさむ)
PLM/開発革新センター物理シミュレーション技術部 所属
現在、エレクトロニクス実装技術、および製品開発における数値解析に
従事。



伊東伸孝(いとう のぶたか)

PLM/開発革新センター物理シミュ レーション技術部所属 現在,エレクトロニクス実装技術, および製品開発における数値解析に 従事。

まえがき

携帯電話などモバイル機器に搭載されているLSI パッケージ(以下, PKG)およびメモリなどは, 微細なはんだボールによって実装するBGA (Ball Grid Array)タイプが主流である。これらの部品 を実装するプリント基板(以下, PT板)設計では 落下衝撃に対する信頼性が重要である。実装信頼性 の確認は製品レベルの試験とPT板レベルの試験が ある。本来は製品内に実装された状態で試験する方 が、より正確な信頼性評価であるが、製品が高価で あることや数量が必要な点で実際に試験は行えない。 その代用として, PT板での試験を行っているが, 手作業で落下試験を行っているためPT板の落下姿 勢を一定にすることが難しく,安定した評価を行う ことができないなどの問題があった。これらの解決 方法として,PT板の自由落下と同程度の衝撃歪み を与える鋼球落下による評価法を提案し {図-1 (a)}, その適用方法を検討してきた(1)-(6)また,落下プ ローブによる衝撃曲げ試験のやPT板を治具に固定





し垂直落下させる試験方法⁽⁸⁾なども提案され研究が 続けられている。そこで,鋼球落下による衝撃寿命 測定のための装置を試作しBGAの寿命試験方法に 関して実験を行った。例えば,鋼球落下衝撃では PT板の固定方法の違いと衝撃歪みの対係,および BGA破断判定法などを検討してきた。同時に,自 由落下と鋼球落下衝撃による歪みを衝撃解析ソルバ "LS-DYNA"によって計算し,PT板表面に作用す る衝撃歪み波形をそれぞれの実測結果と比較した。

本稿では、衝撃という特殊な状況におけるPT板 やBGAの挙動を再現するための取組みについて紹 介する。

鋼球落下衝擊試験

鋼球落下衝擊試験装置

鋼球によって,繰り返しPT板に衝撃を与える装置を試作した {図-1(b)}。装置仕様は以下のとお りである。

- (1) 試験可能なPT板寸法: 50~300 mm
- (2) 鋼球の重量:3~20g(6種類)
- (3) 落下高さ: 50~1,000 mm
- (4) 落下回数:任意に設定可能
- (5) A/D入力: 歪みゲージ=3本

:はんだ破断判定(電圧)=4本

この装置では,初めにナイロン製の紐につなが れた鋼球を設定高さの位置決め用ブロックまで引き 上げて,紐を押さえて固定する。つぎに紐の押さえ を開放し,PT板上に鋼球を自由落下させ衝撃を与 える。装置は衝突して跳ね上った鋼球が再びPT板 に当たらないように紐の長さを調整する「2度当た り防止機構」が装置上部に設けてある。衝撃歪みと 破断電圧は,紐が開放されてから1.0秒間記録され る。装置は破断電圧,または最大,最小歪みが設定 した範囲を超えた場合,自動的に停止するように なっている。

繰返し精度

表-1は落下高さと落下位置のばらつきを円の直径 で,最大衝撃歪みのばらつきを標準偏差で表したも のである。この結果から,安定した衝撃負荷を繰り 返し与えられる装置であることが分かる。例えば, 落下高さが900 mmの場合,衝撃負荷1サイクルは 約30秒であり,100回の衝撃試験が1時間で行える。

表-1 繰返し精度(鋼球重量 = 5.4g,繰返し数 = 20)				
落下高さ (mm)	落下位置精度(mm)	衝撃歪みのばらつき (標準偏差:)		
150.0	1.5	0.063195		
200.0	2.5	0.093963		
300.0	3.5	0.174111		
500.0	2.5	0.103797		
700.0	5.0	0.369454		
900.0	6.0	0.557059		





PT板の衝撃歪み

鋼球の落下高さと衝撃歪み

落下高さと衝撃歪みの関係を求めることは,落下 試験機で衝撃寿命試験を行うときの指標になる。そ こで,5.4gの鋼球をPKGの中心(P1)に落下させ, PKGコーナ近傍の歪みを測定した。また,歪みは 同じ高さで20回測定した平均で,同じPT板を2度 測定している。図-2(b)は落下高さと最大衝撃歪 みの関係を示すグラフである。このグラフは落下高





さと衝撃歪みが比例関係にあることを示している。 PT板の拘束条件と衝撃歪み

PT板の固定法を変えたとき,衝撃歪み波形がどのような変化をするか測定した。固定方法は,

(1) PT板コーナ4箇所固定

 (2) 固定なし(PT板コーナのみ台に載せた状態)
 で行った。試験条件は,鋼球重量=5.4g,落下高 さ=500mm,落下位置=PKG中心から(x=10, y=10)の位置である{図-2(a)のP2}。図-3は歪 み波形の測定結果である。初期歪み周期T₀/2を比較 すると,

(1) 2.8×10-3秒(4箇所固定)

(2) 2.8×10-3秒(固定なし)

であり,鋼球衝突時の歪み波形もよく似ている。To/2 以降は歪み周期,振動時間にズレが見られるが,全 体的な違いは少ない。これより,鋼球落下衝撃によ る最大歪みはPT板拘束との相関は小さく,鋼球の 重さと落下速度,およびPT板の固定間隔で決まる。

基板の衝撃歪みと寿命

鋼球の落下によって繰り返しPT板に衝撃を加え ると,BGAに応力が作用し境界面に亀裂が発生す る。衝撃寿命とは,この亀裂が成長しBGAが破断 するまでの衝撃負荷回数のことである。ここでは, PKGコーナ部の歪みを参考に破断までの衝撃回数 について寿命試験を行った。図-4(a)は,はんだ の破断判定回路である。実験に用いたPKGの場合, 100 の抵抗を入れ,6.0 Vの電圧を負荷すると, 初期端子間抵抗 R_0 = 1.38 ,電圧 V_0 = 42 mVで あった。鋼球による衝撃でBGAの亀裂破壊が進行 して,抵抗が30%上昇し R_1 = 1.80 ,電圧 V_1 = 60 mV 以上になったとき「破断」と判定するように設定し

鋼球落下による基板の衝撃強度信頼性評価



Fig.4-Method of judging solder rupture and measurement result.

た。図-4(b)は,破断までの鋼球落下回数とPKG コーナの衝撃歪みの平均をプロットしたグラフであ る。実験結果にはばらつきが大きく評価法としては 不安定なところがあり,試験方法や破断判定法など 改良する必要があるが,およそ衝撃歪みと落下回数 に相関が見られる。

衝擊解析

鋼球落下試験装置によるPT板の衝撃歪み特性や BGAの破断判定方法など実験による信頼性の検討 と同時に,将来,衝撃解析のみでPKGの実装信頼 性を予測するための解析手法確立のため,実測の歪 み波形と比較を行った。

衝撃解析用モデル

図-5(a)は衝撃解析に用いたPT板の全体モデル, 図-5(b)はそのPKG内部を拡大表示したものであ る。はんだの材料は62Sn-36Pb-2Ag(共晶), BGA の寸法は直径350 µm×高さ230 µm, BGA総数は 240個である。モールド樹脂,LSI,ポリイミドお よびダイボンドなど正確に形状をモデル化している。 材料物性値はカタログ値を用いたが, PT板だけは 引張試験で求めた実測値を用いている。



PT板の粘性減衰係数

PT板の衝撃解析で粘性減衰係数を「ゼロ」とした場合,歪み振幅があまり減衰しない。図-6(b)の鋼球落下衝撃の歪み波形から周期T=5.26×10⁻³ 秒が求まる。これより臨界減衰係数Ds=2 =2× 2 ÷T=2,389と計算される。一般的な減衰振動の 場合, =0.2Dsであることから,本事例の衝撃解 析においても粘性減衰係数 =0.2×2,389 500と 定義した。

衝撃歪み波形の比較

鋼球落下衝撃歪み波形の比較

図-6(a)は衝撃解析におけるPT板表面歪みの計 算方法を示している。PT板全体の解析モデル表面 に歪みゲージと同じように,計算に影響がない程度 の剛性(縦弾性係数)と厚さを有する板要素 (SHELL)を作成し,この要素の歪みを計算する。

図-6(b)は, PT板解析モデル(図-5)の四隅を 固定し,その裏側中央に鋼球(重量=5.4g)を高さ 350 mmから落下させたときのPKG近傍{図-6(a)} の衝撃歪みを,解析と実測で比較したグラフである。

なお,実測での歪み波形は鋼球落下時の空気抵抗 や機械的なロスがあるため理論値より小さくなる。 衝突直前の落下速度を計測し,解析での値を参考に 落下高さを求めると,鋼球落下では高さ400 mmに

鋼球落下による基板の衝撃強度信頼性評価



(a) 衝撃歪み計算用板 (SHELL) 要素







実測t/2 = 2.50 × 10 - 3秒

解析T/2=2.64×10-3秒

である。また,最大歪みは実測および解析とも

 $_{\rm max}$ = 2.5 × 10 $^{-3}$

である。鋼球がPT板に衝突して,最も変形した状態から跳ね返ってもとの状態に戻るまでの歪み波形 はよく一致している。最初の半波長が衝撃破断の支 配的な要因と考えると,精度の良い解析と言える。

なお,衝撃解析で一部歪みが大きく計算されているところがある {図-6(b)の矢印}。この点は Hourglassモードが顕著に現れ,計算精度が悪いの で無視した。

自由落下衝撃歪み波形の比較

鋼球落下衝撃は,自然落下衝撃での信頼性評価に 替えて行うことを目的に検討してきた。そこで,自 然落下に関しても実験と解析の衝撃歪み波形の比較 を行い,その特徴を検討した。

図-7(a)は自由落下用の解析モデルである。PT 板を水平の状態から x=5.0°, y=8.0°傾け,高 さ500 mmから剛表面上に落下させる。なお,PT 板の減衰係数は鋼球落下の場合と同じく = 500と



図-7 自由落下衝撃歪み比較(実測/解析) Fig.7-Comparison of free drop impact strain, analysis and measurement.

した。鋼球落下用の衝撃解析モデル(図-5)と物性 値をそのまま自由落下衝撃解析に用いて計算し,解 析と実測とで歪み波形を比較した。図-7(b)はPKG 近傍の衝撃歪み波形である。初期歪みの大きさは,

実測; - 1.95×10⁻³

解析; -1.25×10-3

である。落下角度など自由落下の条件を精度良く設 定することができないので同じ歪みにならないが, およその傾向がつかめる。しかし,歪み周期は

実測t/2=1.78×10-3秒

解析T/2 = 3.36 × 10 - 3秒

と実測の約2倍あった。ほかの実測結果と比較して も, 歪み周期の差が大きかった。この原因は今後の 検討課題であるが, PT板が高速で振動したときは, 歪み速度依存の材料特性を考慮する必要があり,通 常の引張り試験で得られた物性値では表現できない 挙動をしていると考えられる。

考	察	

(1) 鋼球落下試験装置

PT板に与える鋼球落下衝撃の影響を正確に把握

鋼球落下による基板の衝撃強度信頼性評価

するため,鋼球の2度当たり防止機構を設けた自動 試験装置を開発した。繰りかえし何度も同じ衝撃を 与えられる特徴を生かして,鋼球の落下高さとPT 板の最大衝撃歪みの関係,およびPT板の拘束条件 の違いによる衝撃歪み波形などの確認ができた。

自由落下による衝撃歪みを鋼球落下で再現した場 合,図-6(b)と図-7(b)のそれぞれの実測結果が 示すように,初期歪み周期と最大歪みは,

- 鋼球落下
- ・初期半周期t/2=2.50×10-3秒
- ・最大歪み max = 2.51 × 10⁻³ 自由落下
- ・初期半周期t/2=1.78×10-3秒
- ・最大歪み max = -1.95×10⁻³

であり,鋼球の重さや落下高さを調整すれば,自由 落下での初期歪みに相当する衝撃を与えることが可 能である。

(2) 鋼球落下衝撃とPT板の歪み

鋼球落下衝撃では,初めは鋼球の衝撃でPT板が 変形して最も撓んだ状態になると,鋼球の速度お よび歪み速度も遅くなる。つぎに,この状態から鋼 球に反対方向の力を与えながらPT板はもとの形状 に戻る。この間,PT板は鋼球の動きによって変形 速度が制限されてしまうため,PT板単体での歪み 速度と比較して遅い状態にあると予想される。した がって,材料の歪み速度依存の影響が小さくなり, 図-6(b)のグラフが示すように初期半周期では実 測と解析での歪み波形がよく一致している。しかし, これ以降はPT板単体の振動(両端固定の振動)に なるため,材料の歪み速度依存特性の影響が顕著に 現れ,波長にズレが生じたと考えられる。

(3) 自由落下衝撃とPT板の歪み

自由落下ではPT板の動きを制限するものがなく, 衝突した瞬間からPT板単体の振動(両端自由の振動)になる。したがって,歪み測定の開始時刻から PT板材料の歪み速度依存特性の影響が現れ,歪み 周期のズレとして測定されたと考えられる{図-6(b)}

む す び

繰り返し落下位置精度と衝撃歪みの良さを利用し て、衝撃歪みと落下高さの関係、はんだの衝撃寿命 測定を行い、ある程度の傾向が把握できた。しかし、 実際のPT板衝撃寿命試験との相関があまり見られ ないなど問題もあり,信頼性試験法として不十分で ある。衝撃解析ソルバ"LS-DYNA"で検討した結 果,同じ初期歪みでもその特性が違うことが分かっ てきた。自由落下衝撃では実測と解析とで歪み周期 に2倍の差があるなど,材料の歪み速度依存の影響 が現れているようである。鋼球落下での試験方法で は歪み速度依存の影響を再現できないため,同じ衝 撃試験でもPT板の歪み速度が遅く,構造減衰など が作用する,実製品レベル(例えば携帯電話内の PT板など)での衝撃を模擬した試験に適用できる ものと思われる。

今後は、はんだの歪み速度を考慮してBGAおよ び界面に作用する衝撃歪みの解析を行い、通常のは んだ物性値で計算した結果と比較検討する。また、 解析と実験を行いながら鋼球落下試験装置の改良や 衝撃歪みとはんだの実装信頼性、および寿命の関係 を調査する予定である。

参考文献

- (1) 石川重雄ほか:携帯電子機器における半田接合部の落下衝撃強度評価.第11回計算力学講演会 講演論 文集(1998).
- (2) 井門修ほか:モバイル機器マイクロ接合の衝撃試
 験法.日本機械学会材料力学部門講演会講演論文集
 (2000).
- (3) 舘野正ほか:鋼球落下による基板の衝撃強度評価法.第15回計算力学講演会講演論文集(2002).
- (4) 舘野正ほか:鋼球落下による基板の衝撃強度評価
 法 FBGAパッケージ近傍に作用する衝撃歪みの評価.第16回計算力学講演会講演論文集(2003).
- (5) 舘野正ほか:鋼球落下による基板の衝撃強度評価法
 法.第17回エレクトロニクス実装学術講演大会論 文集(2003).
- (6) 井門修ほか:モバイル機器の衝撃強度評価試験手法.第18回エレクトロニクス実装学術講演大会論文集
 (2004).
- (7) 矢口昭弘ほか: BGAはんだ接合部の衝撃曲げ試験
 法.第16回エレクトロニクス実装学術講演大会論文集
 (2002).
- (8) 干 強ほか:繰り返し落下衝撃試験装置の開発と 実装はんだ接合部の落下衝撃強度評価.第15計算力学 講演会講演論文集(2002).